

Vékonyrétegek vizsgálata reflektometria módszerekkel

Friday 25 August 2023 14:15 (15 minutes)

A mikroelektronika fejlődése forradalmi változásokat okozott életünkben, így a vékonyrétegek vizsgálati módszereinek fejlesztése az anyagtudományi kutatások fókuszába került. Roncsolásmentes vizsgálatok jól ismert képviselője a rugalmas szóráson alapuló reflektometria, amelynek során valamilyen részecske (hullám) felületről való visszaverődését vizsgáljuk. Az előadásban atomi méretű rétegekből álló szerkezetek spekuláris és diffúz, neutron- ill. Röntgen-szórását fogjuk áttekinteni. Bemutatjuk a rétegek osztályozására alkalmas, reflektometriailag kinyerhető információkat.

Primary author: Dr DEÁK, László (NKE HHK Természettudományi Tanszék)

Presenter: Dr DEÁK, László (NKE HHK Természettudományi Tanszék)

Session Classification: Kísérleti fizika és alkalmazott matematika